

Pólusábrák CHI-metszeteinek roncsolásmentes mérése hidegen hengerelt alumínium lemezekben

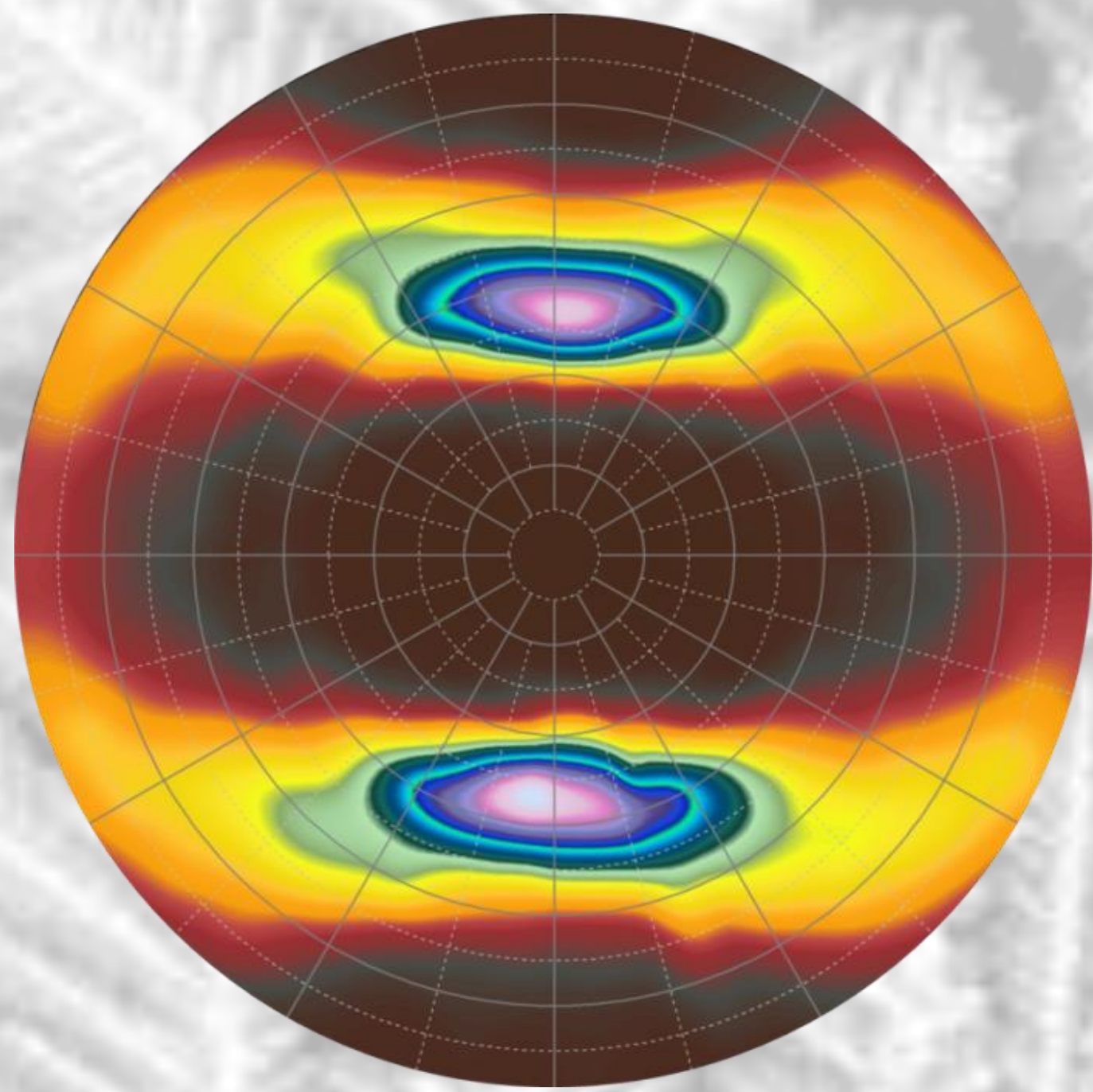
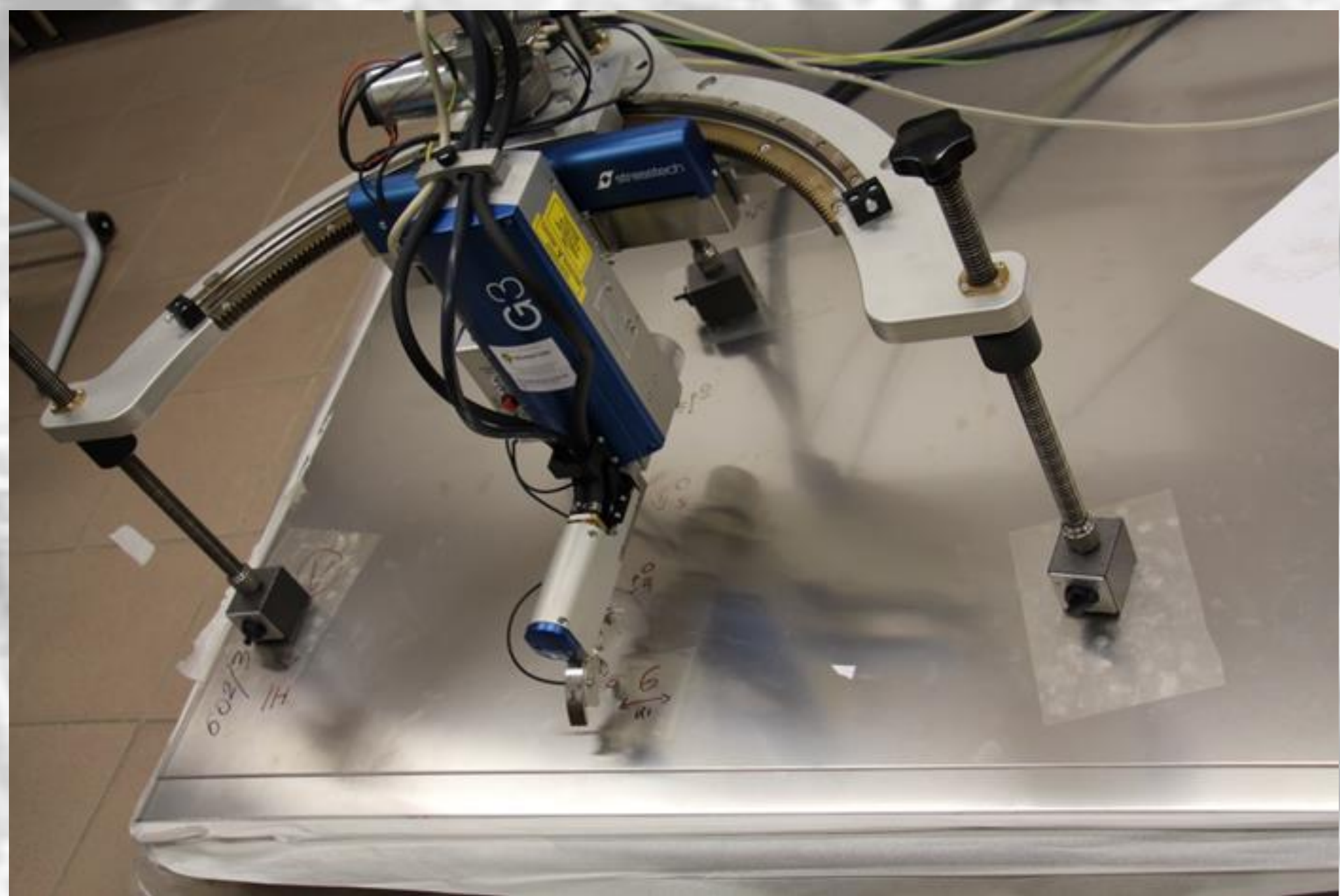
Hlavács Adrienn¹, Sepsi Máté¹, Dr. Mertinger Valéria¹, Dr. Benke Márton¹

¹Miskolci Egyetem Fémtani Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet



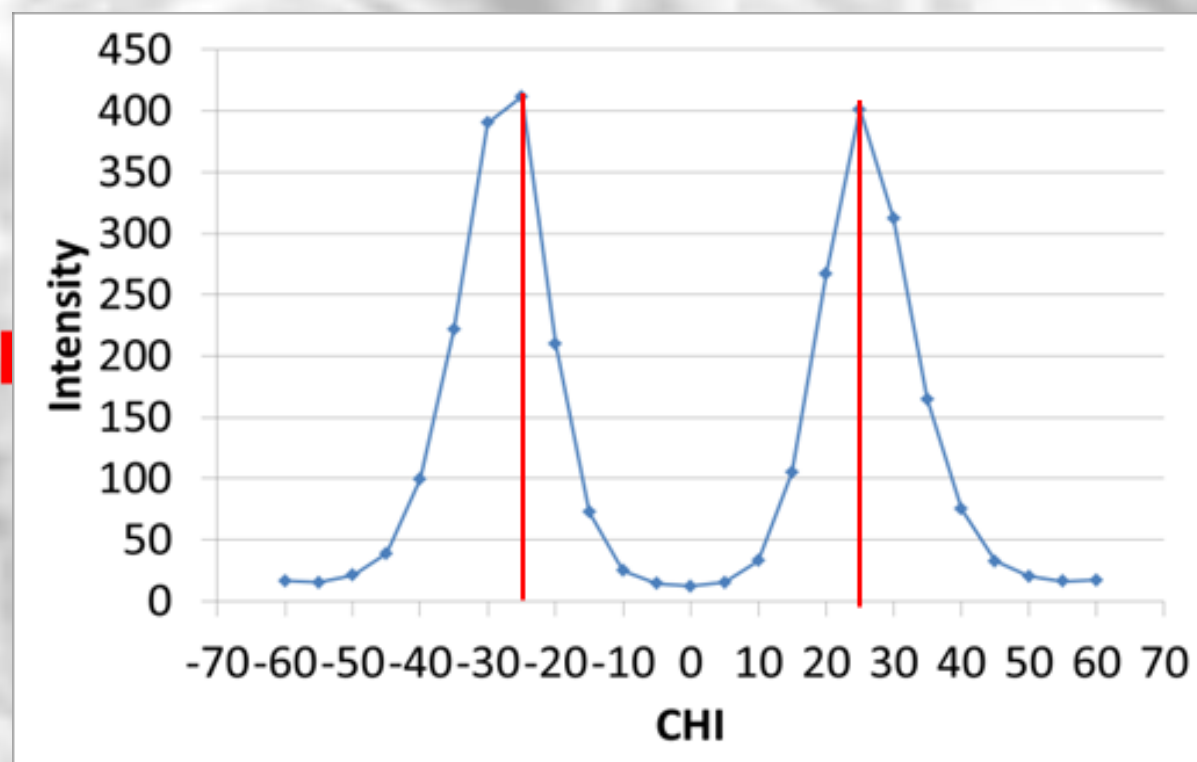
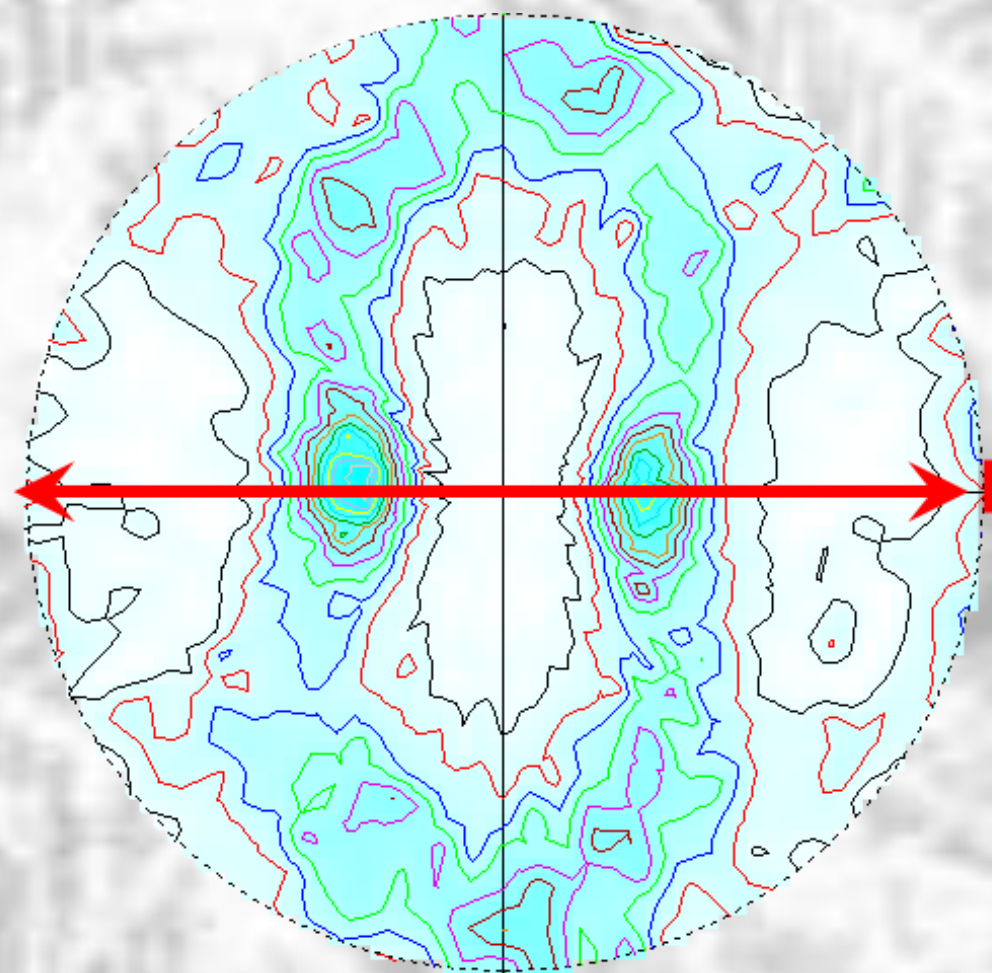
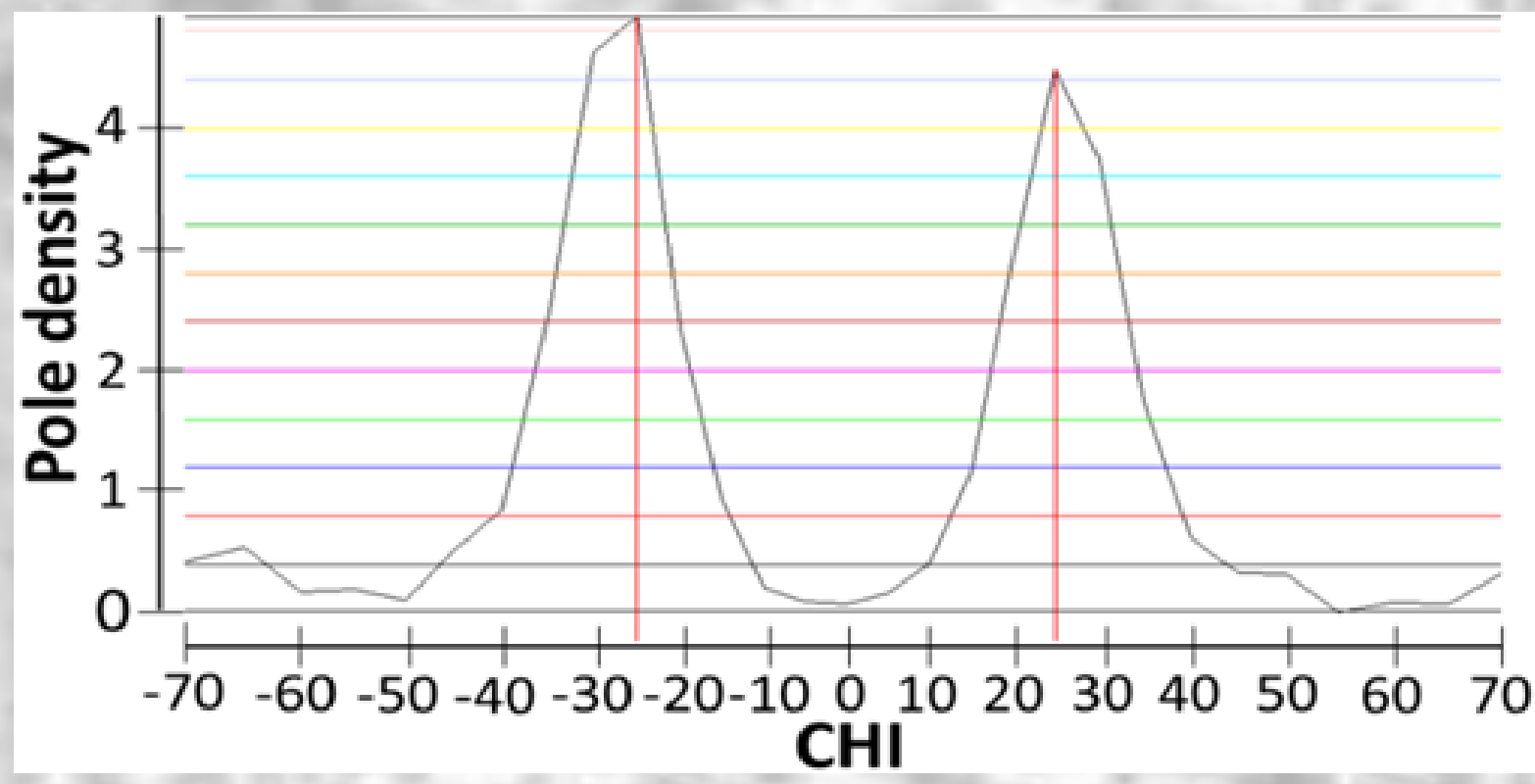
Célkitűzés

A Stresstech G3R berendezéshez a Miskolci Egyetem Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetének Röntgendiffrakciós Laboratóriuma 2015 és 2016 között kidolgozott egy méréstechnikát, aminek alkalmazásával a kristálytani textúra jellemzése elvégezhető központ nélküli röntgendiffraktométerrel. Vizsgálataink célja, hogy a kidolgozott méréstechnikával meghatározott CHI-metszetek mennyire felelnek meg a konvencionális módon (Bruker D8 Advance) meghatározott HI irányú CHI-metszeteknek olyan mintasorozaton, amelyek különböző mértékű textúrával rendelkeznek.



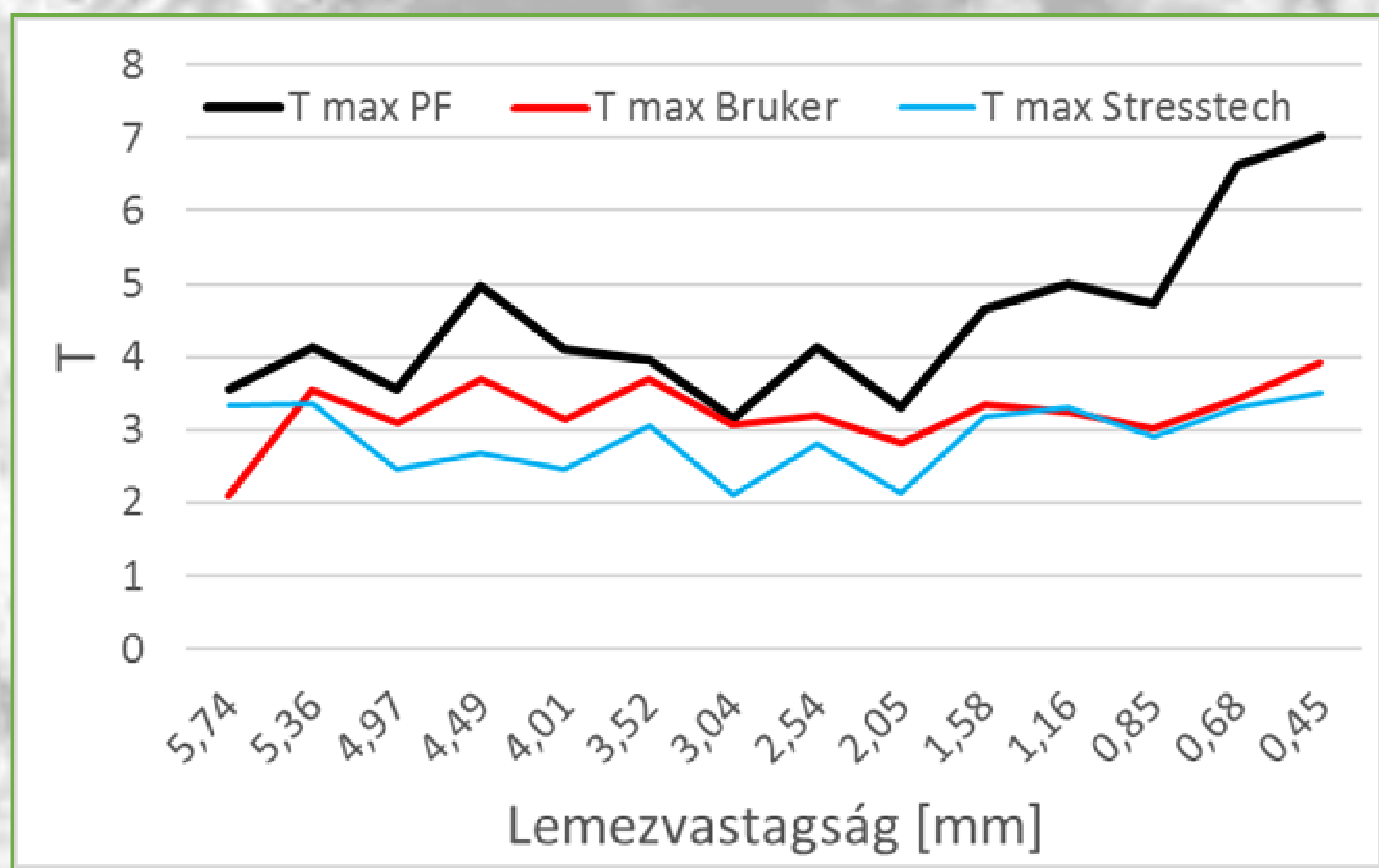
Bruker D8 Advance
Euler bölcsovel ellátott
röntgendiffraktométer

Stresstech G3R
központ nélküli
röntgendiffraktométer



Vizsgálatok Próbásor

Következtetések
Próbásor



Eredmények összehasonlítása

